

МАГНИТОКАЛОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ПЕРЕМЕННОМ ПОЛЕ

А.И.Морозов

Рассматривается накачка возбуждений в сверхпроводящей пленке низкочастотным полем, вызывающая охлаждение сверхпроводника.

В данной работе изучается зависимость числа возбуждений в сверхпроводнике от периодического изменения щели в их спектре. При низких температурах возможно так выбрать частоту переменного магнитного поля, вызывающего изменение щели, что фононная система будет успевать подстраиваться под электронную. В этом случае можно легко получить решение кинетического уравнения. Рассматривается также возможность охлаждения сверхпроводника путем изменения числа возбуждений данным методом.

Рассмотрим тонкую сверхпроводящую пленку толщиной $d \ll \xi$, δ где ξ – длина когерентности, а δ – глубина проникновения магнитного

поля. Пусть к пленке приложен векторный потенциал $\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 \cos \omega t$, причем \mathbf{A} направлен параллельно пленке и $|\mathbf{A}_1| \gg |\mathbf{A}_2|$. Ограничимся случаем сильно "загрязненной" примесями пленки и частотами $\omega \Delta \ll 1$, где Δ — параметр сверхпроводимости. Тогда согласно [1, 2] щель в спектре возмущений

$$\epsilon_0 = \epsilon_0^{(0)} - \left(\frac{\epsilon_0^{(0)}}{a_0} \right)^{1/3} a_\omega \cos \omega t, \quad (1)$$

где $\epsilon_0^{(0)}$ — щель в отсутствие переменного по времени поля \mathbf{A}_2 ,

$$a_0 = \frac{2}{3} \tau \frac{e^2}{c^2} v_F^2 \langle A_1^2 \rangle; \quad a_\omega = \frac{2}{3} \tau \frac{e^2}{c^2} v_F^2 \langle A_1 A_2 \rangle$$

τ — время между столкновениями с примесями, v_F — скорость электрона на поверхности Ферми, e — заряд электрона, c — скорость света.

Символ $\langle \rangle$ означает усреднение по толщине пленки. Выражение (1) получено в случае $a_0 \ll \epsilon_0$, которым мы и ограничимся.

Так как толщина пленки по сравнению с характерными величинами ξ и δ , и \mathbf{A}_1 и \mathbf{A}_2 постоянны вдоль пленки, то задача однородна. При $\mathbf{A}_1 = 0$ соответствующее кинетическое уравнение было выведено Элиашберггом [3]. При $\mathbf{A}_1 \neq 0$ меняется плотность спектра возбуждений и факторы когерентности в кинуровнении. Эти величины получены согласно [1]. Новая плотность состояний

$$\rho_\epsilon = \rho_0 \left(\frac{2}{3} \right)^{1/2} \left(\frac{\Delta^2}{a \epsilon_0} \right)^{1/6} \sqrt{\frac{\epsilon - \epsilon_0}{a}}, \quad (2)$$

а факторы $1 \pm \frac{\Delta^2}{\epsilon \epsilon_1}$ изменяются на $1 \pm \left(\frac{\epsilon_0}{\Delta} \right)^{2/3}$ для $\epsilon - \epsilon_0 \ll a$, где $a = a_0 + a_\omega \cos \omega t$, а ρ_0 — плотность спектра нормального металла на поверхности Ферми. Мы рассмотрим случай низких температур $T \ll a$, а нам существенны только $\epsilon - \epsilon_0 \sim T$.

В интеграле столкновений кинуровнения есть члены, описывающие процессы поглощения и испускания электроном фонона, и член, описывающий развал фонона на два возбуждения и обратный процесс.

Время первых процессов $\tau_1 \sim \frac{\Theta_D^2 \Delta^{1/2}}{\lambda T^{7/2}}$ при $T \ll \Delta$ намного меньше

характерного времени вторых процессов

$$\tau_2 \sim \left(\frac{a^4}{\Delta^{13}} \right)^{1/6} \frac{\Theta_D^2}{\lambda T^{3/2}} \exp\left(\frac{\epsilon_0}{T} \right),$$

где λ — константа электрон-фононного взаимодействия, Θ_D — температура Дебая.

Пусть $\tau_1 \omega \ll 1 \ll \tau_2 \omega$. Тогда во время изменения поля электроны и фононы находятся в равновесии друг с другом, но число электрон-

ных возбуждений неравновесно. При этом их функция распределения имеет фермиевский вид с химпотенциалом, не равным нулю. Тогда члены, соответствующие первым процессам зануляются, и уравнение можно проинтегрировать и получить уравнение на полное число возбуждений.

Пусть сначала пленка находится в хорошем контакте со средой и $T = \text{const}$. Пусть Z — отношение числа возбуждений в пленке к их равновесному значению X_0 при $A_2 = 0$

$$\frac{dZ}{dt} = \frac{1}{\tau_2} \{ \exp(\kappa \cos \omega t) - Z^2 \}, \quad (3)$$

где

$$\tau_2^{-1} = \frac{2\pi\lambda}{\rho_0 \Theta_D^2} \left[1 + \left(\frac{\epsilon_0}{\Delta} \right)^{2/3} \right] \epsilon_0^2 X_0^2;$$

$$\kappa = 2 \left(\frac{\epsilon_0^{(0)}}{a_0} \right)^{1/3} \frac{a_0 \omega}{T}.$$

Пренебрегая зависимостью от времени всюду, кроме экспоненты, и учитывая, что Z мало меняется за период, получим стационарное решение

$$Z = \sqrt{I_0(\kappa)} + \frac{1}{\tau_2 \omega} \int_0^{\omega t} [\exp(\kappa \cos x) - I_0(\kappa)] dx \quad (4)$$

$I_0(\kappa)$ — функция Бесселя, при $\kappa \gg 1$. $I_0(\kappa) \sim \frac{\exp(\kappa)}{\sqrt{2\pi\kappa}}$. Количество

возбуждений существенно возросло, фононы при этом будут равновесны, если время распада фонона на два $\tau_3 \ll \omega^{-1}$ для энергий $\sim 2\epsilon_0$ [4,5].

Теперь рассмотрим термоизолированную пленку. Увеличение числа возбуждений вызовет ее охлаждение. При этом новую температуру можно найти из закона сохранения энтропии. Она сначала резко уменьшится по сравнению с начальной температурой T_0 , а потом будет слабо изменяться в течение периода колебаний поля. Энтропия возбуждений $S(T, t)$ находится как энтропия неравновесного ферми-газа [6]

$$S(T, t) = \frac{4\epsilon_0^{(0)}}{T} Z(T, t) X_0(T), \quad (5)$$

$$\frac{T_0 - T}{T_0} = \frac{S(T_0, t) - S(T_0, 0)}{C(T_0, t)} \quad (6)$$

для $T_0 - T \ll T_0$, где $C(T, t)$ — суммарная теплоемкость образца.

При значениях $T_0 \sim 1^\circ$, $\Delta \sim 10^\circ$, $\Theta_D \sim 100^\circ$ и других характерных металлических величинах $\tau_1, \tau_3 \sim 10^{-7}$ сек, $\tau_2 \sim 10^{-5}$ сек, $\omega \sim 10^6$ сек $^{-1}$ и $\frac{T_0 - T}{T_0} \sim 10^{-1}$.

Эффект легко можно наблюдать, пропуская через термоизолированную пленку переменный ток.

Я благодарен Г.М.Элиашбергу за ценные обсуждения.

Московский
физико-технический институт

Поступила в редакцию
20 февраля 1976 г.
После переработки
18 марта 1976 г.

Литература

- [1] А.И.Ларкин. ЖЭТФ, 48, 232, 1965.
 - [2] К.Маки. Prog. Theor. Phys., 29, 603, 1963; 31, 731, 1964.
 - [3] Г.М. Элиашберг. ЖЭТФ, 61, 1254, 1971.
 - [4] Дж. Займан. Электроны и фононы.
 - [5] Теория явлений переноса в твердых телах. ИЛ, 1962;
А.М.Косевич. Основы механики кристаллической решетки. М.,
Изд. Наука. 1972.
 - [6] Л.Д.Ландау. Статистическая физика. М., изд. Наука, 1964.
-